

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАСВЕТКИ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОЭС

Корнакова О. В.
ОАО «ГСКБ Алмаз-Антей», г. Москва, Россия

При работе оптико-электронной системы (ОЭС) возможны возникновения помех для приема сигнала из-за излучения лазера. В данной работе проведено экспериментальное определение зависимости статистических характеристик ИК — изображений лазерных полей при внеполевой засветке экспериментального макета ОЭС.